

NXP Semiconductors Czech
Republic s.r.o.
1. Maje 1009
756 61 ROZNOV POD RADHOSTEM
Czech Republic



Offenbach, 2019-03-08

Ihr Zeichen
Jozef Sedlak

Ihr Schreiben
2018-12-14

Unser Zeichen - bitte angeben
5016540-4970-0002/257989
TL2/scb

Ansprechpartner
Herr Dipl.-Ing. Schildbach
Tel +49 69 8306 524
Fax +49 69 8306 789
joachim.schildbach@vde.com

PRÜFBERICHT zur Information des Auftraggebers

Test Report for the Information of the applicant

Produkt / Product: *Mikro-Controller*

Typ / Type: *MKV1x, MKExx, MKLxx, MKE1xZ, MK32W0x, MKV3x, MKV4x, MKV5x, MKE1xF, MIMXRT10xx*

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen. Die Prüfung wurde durchgeführt vom 2019-02-27 bis 2019-02-28.

This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. The testing was carried out from 2019-02-27 to 2019-02-28.

Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der unten genannten Regelwerke.

The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.



Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an gleicher Stelle verfügbar gemacht werden.

Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

I BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Produkt / Product: Selbst-Diagnose-Routinen für Milro-Controller Familie der Typen
Self-Diagnostic Routines for Micro Controller Family Types

MKV1x, MKExx, MKLxx, MKE1xZ, MK32W0x, MKV3x, MKV4x, MKV5x, MKE1xF, MIMXRT10xx

Typ / Type:	Dateiname / File name	Version / Version
	IEC60730_Kinetis_CM0_Class_B_IAR_v3_x.a	3.x
	IEC60730_Kinetis_CM0_Class_B_KEIL_v3_x.lib	3.x
	IEC60730_Kinetis_CM0_Class_B_MCUX_v3_x.a	3.x
	IEC60730_B_reg.S	3.x
	IEC60730_B_pc.S	3.x
	IEC60730_B_pc_object.S	3.x
	IEC60730_B_ram.S	3.x
	IEC60730_B_flash.S	3.x
	IEC60730_B_clock.c	3.x
	IEC60730_B_dio.c	3.x
	IEC60730_B_dio_ext.c	3.x
	IEC60730_B_aio.c	3.x
	IEC60730_B_tsi.c	3.x
	IEC60730_Kinetis_CM4_CM7_Class_B_IAR_v3_x.a	3.x
	IEC60730_Kinetis_CM4_CM7_Class_B_KEIL_v3_x.lib	3.x
	IEC60730_Kinetis_CM4_CM7_Class_B_MCUX_v3_x.a	3.x
	IEC60730_B_CM4_CM7_reg.S	3.x
	IEC60730_B_CM4_CM7_reg_fpu.S	3.x
	IEC60730_B_CM4_CM7_pc.S	3.x



IEC60730_B_CM4_CM7_pc_object.S	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_ram.S	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_flash.S	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_flash_DCP.c	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_clock.c	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_dio.c	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_dio_ext.c	3.x
IEC60730_B_CM4_CM7_aio.c	3.x

Anmerkung / Remarks:

Zu Details der Dateien siehe VDE-Prüfbericht /
For details of files see VDE Test Report:

257989-TL2-1

II NORMEN / STANDARD**Prüfnorm(en) / Standard(s) used:**

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10	EN 60335-1:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04	EN 60335-1:2012/AC:2014
Annex R	EN 60335-1:2012/A11:2014
	Annex R
DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2012-10	EN 60730-1:2011
Annex H	Annex H
IEC 60335-1:2010	
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013	
IEC 60335-1:2010/AMD2:2015	
Annex R	
IEC 60730-1:2013	
IEC 60730-1:2013/AMD1:2015	
Annex H	



III PRÜFUNG / TEST

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen nach Tabelle R.1 / H.1 der unter II benannten Normen. /

The self-diagnostic routines mentioned under I are foreseen for following measures of table R.1 / H.1 of the standards mentioned under II.

Dateiname / File name	Maßnahme / Measure
IEC60730_B_reg.S IEC60730_B_CM4_CM7_reg.S IEC60730_B_CM4_CM7_reg_fpu.S	1.1 Register
IEC60730_B_pc.S IEC60730_B_pc_object.S IEC60730_B_CM4_CM7_pc.S IEC60730_B_CM4_CM7_pc_object.S	1.3 Programme counter
IEC60730_B_clock.c IEC60730_B_CM4_CM7_clock.c	3. Clock
IEC60730_B_flash.S IEC60730_B_CM4_CM7_flash.S IEC60730_B_CM4_CM7_flash_DCP.c	4.1 Invariable memory
IEC60730_B_ram.S IEC60730_B_CM4_CM7_ram.S	4.2 Variable memory
IEC60730_B_dio.c IEC60730_B_dio_ext.c IEC60730_B_CM4_CM7_dio.c IEC60730_B_CM4_CM7_dio_ext.c	7.1 Digital I/O (for output mode only)
IEC60730_B_aio.c IEC60730_B_tsi.c IEC60730_B_CM4_CM7_aio.c	7.2.1 A/D- and D/A- converter

Zu Details der Prüfungen siehe VDE-Prüfbericht /
For details of testing see VDE Test Report:

257989-TL2-1



IV ERGEBNIS / RESULT

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen erfüllen die Anforderungen der unter II benannten Normen. Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen können zum Aufbau einer Selbst-Test-Bibliothek gemäß der unter II benannten Normen verwendet werden. /

The self-diagnostic routines mentioned under I fulfill the requirements of the standards mentioned under II. The self-diagnostic routines mentioned under I are suitable to be used to create a self-test library according the standards mentioned under II.

Best regards

VDE Testing- and Certification Institute
Appliances and Systems for House and Commercial Use



Dipl.-Ing. (FH) K. Tas



Dipl.-Ing. (FH) J. Schildbach

